



株式会社オプトサイエンス技術部では、微量位置決め・画像処理ソフト・自動計測ソフト等の総合技術で、半導体レーザ光部品の計測・検査システムをご提供致します。

半導体レーザテスタ

本製品は、半導体レーザの電気的特性を設定温度毎に測定する装置で、半導体レーザ電源とパワーメータ、ペルチェコントローラとから成る半導体レーザテスタです。

LD駆動系

電流範囲	1 A オプションで高分解能300mA及び大電流2A, 6A, 10Aも可能
電流分解能	0.1mA
出力電圧	3V (max) 3.2Vで制限 (オプションにて変更可)
駆動極性	耐極性
駆動方式	定電流 (ACC) / 定出力 (APC) 駆動 (定電流回路)

温度制御

検出素子	白金測温体またはサーミスタ (パラメータ可変)
制御素子	ペルチェ素子
温度範囲	-40 ~ 80



測定項目

- ・ I-L特性
- ・ I-V特性
- ・ I-Im特性
- ・ I-dL/dI特性
- ・ I-dV/dI特性 等

半導体レーザ冷却用チャンバ

-40 までの到達時間わずか3分!!

-40 ~ 80 の範囲で
設定した温度で
半導体レーザの
電気特性を測定。



光技術をサポートする

株式会社オプトサイエンス

<http://www.optoscience.com>

東京本社 〒160-0014 東京都新宿区内藤町1番地 内藤町ビルディング
 TEL:03(3356)1064 FAX:03(3356)3466 E-mail:info@optoscience.com
 大阪支店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-7-2 新大阪ビル西館
 TEL:06(6305)2064 FAX:06(6305)1030 E-mail:osk@optoscience.com
 名古屋営業所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-37-21 東海ソフトビル
 TEL:052(569)6064 FAX:052(569)8064 E-mail:ngo@optoscience.com

